Проектирование ИС (часть 2) Тема 3: Метрики объектноориентированных систем

Объем лекций по теме: 4 часа

Лектор: Щеголева Людмила Владимировна

Тема 3: Метрики ОО систем Содержание

- Характеристики ОО систем
- Метрики Чидамбера и Кемерера
- Метрики Лоренца и Кидда
- Метрики Абреу

Характеристики ОО систем

Тема 3: Метрики ОО систем

Цели создания метрик

- улучшить понимание качества продукта
- оценить эффективность процесса проектирования и разработки
- улучшить качество работы на этапе проектирования

Характеристики ОО систем

- локализация
- □ инкапсуляция
- □ информационная закрытость
- □ наследование
- □ абстракция

Метрики Чидамбера и Кемерера

Тема 3: Метрики ОО систем

Метрики Чидамбера и Кемерера

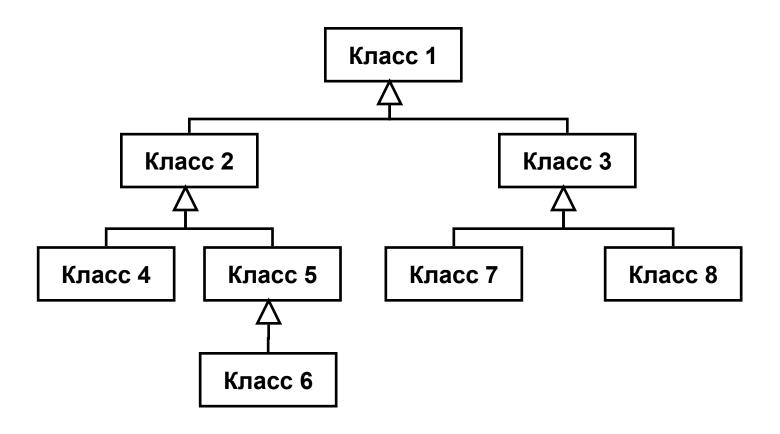
- □ взвешенные методы на класс
- □ высота дерева наследования
- □ количество детей
- □ сцепление между классами объектов
- □ отклик для класса
- □ недостаток связности в методах

Метрики Чидамбера и Кемерера:

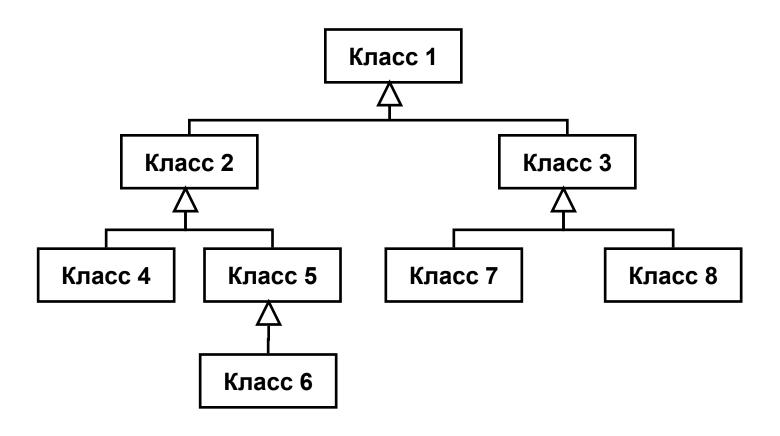
1. Взвешенные методы на класс (WMC)

$$WMC = \sum_{i=1}^{n} c_i$$

Метрики Чидамбера и Кемерера: 2. Высота дерева наследования (DIT)



Метрики Чидамбера и Кемерера: 3. Количество детей (NOC)

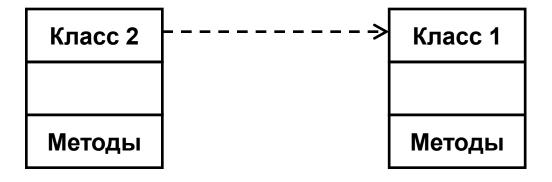


Метрики Чидамбера и Кемерера:

4. Сцепление между классами объектов (СВО)



Метрики Чидамбера и Кемерера: 5. Отклик для класса (RFC)



Метрики Чидамбера и Кемерера: 6. Недостаток связности в методах (LCOM)

$$\tilde{A} = \text{card} \{ I_{ij} | I_i \cap I_j = \emptyset \}$$

$$A = \text{card} \{ I_{ij} | I_i \cap I_j \neq \emptyset \}$$

$$LCOM = \begin{cases} \widetilde{A} - A, & \widetilde{A} > A \\ 0, & \widetilde{A} \le A \end{cases}$$

Метрики Чидамбера и Кемерера:

6. Недостаток связности в методах

(LCOM) Пример

Кл	ıa	C	C
IZJ	ıa	C	C

a, b,

C,

Χ,

у,

m, n

M1 {a, b}

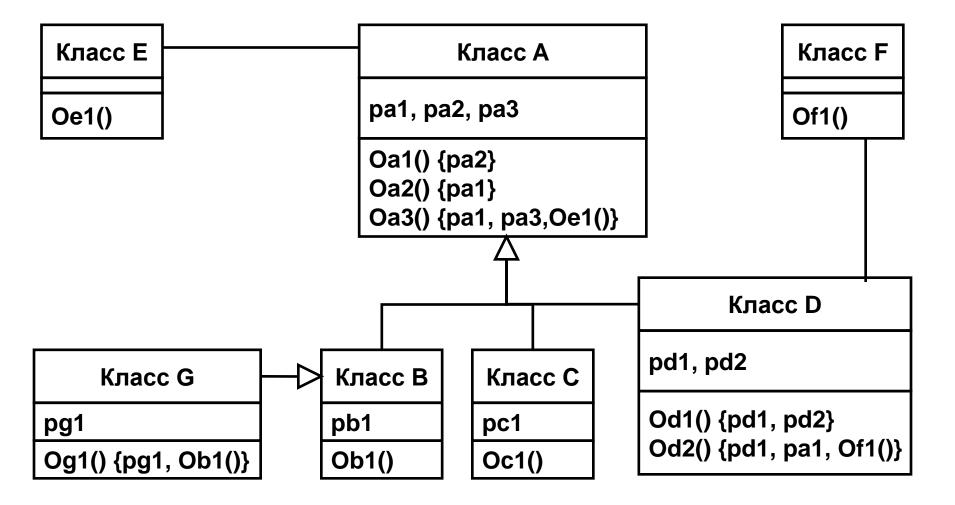
M2 {a, c}

M3 {x, y}

M4 {m, n}

$$LCOM = 5 - 1 = 4$$

Метрики Чидамбера и Кемерера



Метрики Чидамбера и Кемерера

Имя	WMC	DIT	NOC	СВО	RFC	LCOM
класса						
А						
В						
С						
D						
Е						
F						
G						

Тема 3: Метрики ОО систем

- □ размер класса
- количество операций, переопределенных подклассом
- □ количество операций, добавленных подклассом
- □ индекс специализации
- □ средний размер операции
- сложность операции
- □ среднее количество параметров на операцию
- количество описаний сценариев
- количество ключевых классов
- □ количество подсистем

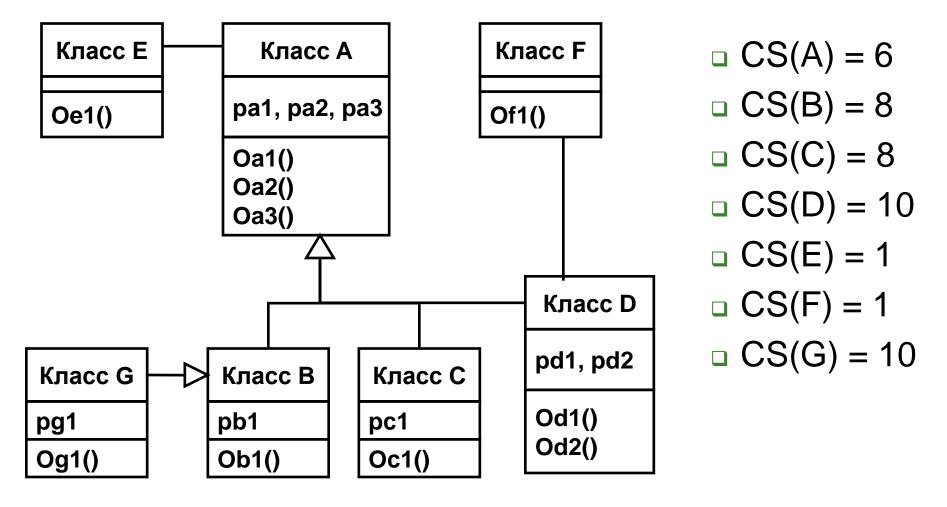
Метрики Лоренца и Кидда: 1. Размер класса (CS)

количество инкапсулированных операций класса

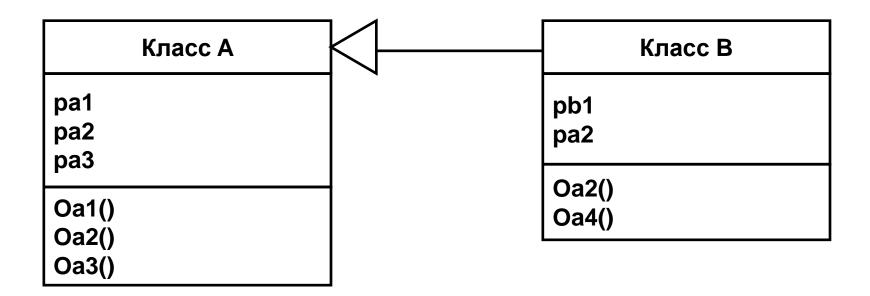
+

количество инкапсулированных свойств класса

1. Размер класса (CS)

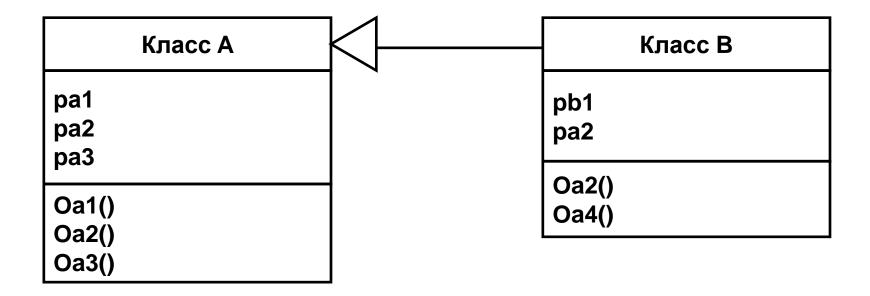


2. Количество операций, переопределенных подклассом (NOO)



□ NOO(B) = 1

3. Количество операций, добавленных подклассом (NOA)



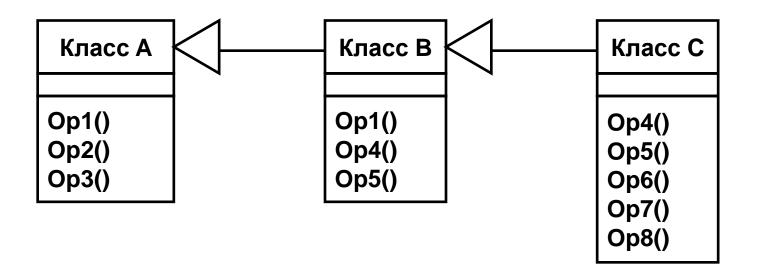
□ NOA(B) = 1

Метрики Лоренца и Кидда: 4. Индекс специализации (SI)

$$SI = (NOO * уровень) / M_{oбщ}$$

- уровень номер уровня в иерархии, на котором находится подкласс
- М_{общ} общее количество методов класса

4. Индекс специализации (SI)



$$SI(A) = \frac{0.1}{3} = 0$$
 $SI(B) = \frac{1.2}{5} = 0.4$ $SI(C) = \frac{2.3}{8} = 0.75$

Метрики Лоренца и Кидда: 5. Средний размер операции (OS_{avq})

количество строк программы

Метрики Лоренца и Кидда: 6. Сложность операции (ОС)

Параметр	Bec
Вызовы функций АРІ	5
Присваивания	0,5
Арифметические операции	2
Сообщения с параметрами	3
Параметры	0,3
Временные переменные	0,5

Метрики Лоренца и Кидда: 6. Сложность операции (ОС)

```
void Push(int item) {
  if (top==size)
     printf("Empty stack.\n");
  else
     array[top++]=item;
}
```

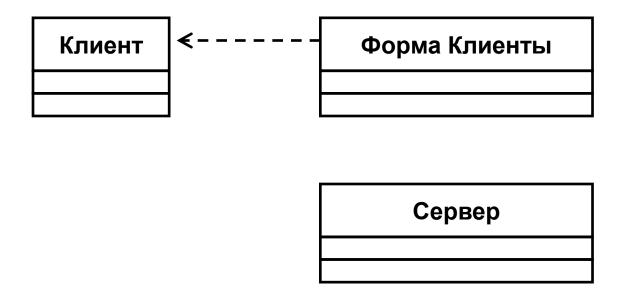
OC = 0.3 + 2 * 0.5 + 2 + 5 = 8.3

Метрики Лоренца и Кидда: 7. Среднее количество параметров на операцию (NP_{avg})

Метрики Лоренца и Кидда: 8. Количество описаний сценариев (NSS)

количество классов, необходимых для реализации требований

Метрики Лоренца и Кидда: 9. Количество ключевых классов (NKC)



Метрики Лоренца и Кидда: 10. Количество подсистем (NSUB)

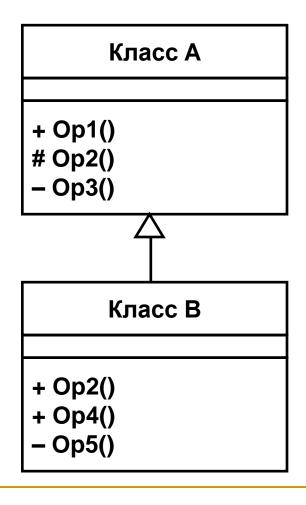
Тема 3: Метрики ОО систем

- фактор закрытости метода
- фактор закрытости свойства
- фактор наследования метода
- фактор наследования свойства
- фактор полиморфизма
- фактор сцепления

1. Фактор закрытости метода (МНF)

$$MHF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} M_h(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} M_d(C_i)}$$

1. Фактор закрытости метода (МНF)



$$M_h(A) = 2$$

 $M_d(A) = 3$
 $M_h(B) = 1$
 $M_d(B) = 3$

$$MHF = \frac{1+2}{3+3} = \frac{3}{6} = 0,5$$

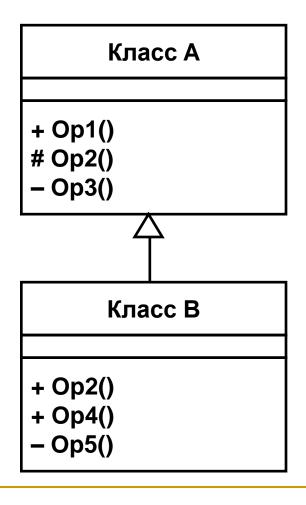
2. Фактор закрытости свойства (АНF)

$$AHF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} A_h(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} A_d(C_i)}$$

3. Фактор наследования метода (MIF)

$$MIF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} M_i(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} M_a(C_i)}$$

3. Фактор наследования метода (MIF)



$$M_i(A) = 0$$

$$M_a(A) = 3$$

$$M_i(B) = 1$$

$$M_a(B) = 4$$

$$MIF = \frac{0+1}{3+4} = \frac{1}{7} = 0.14$$

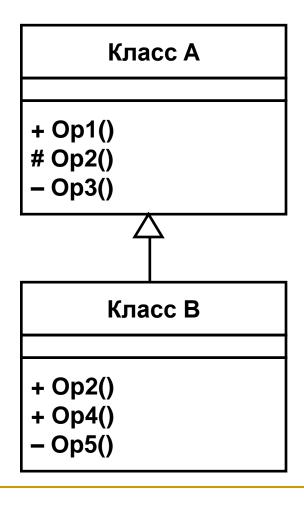
4. Фактор наследования свойства (AIF)

AIF =
$$\frac{\sum_{i=1}^{TC} A_i(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} A_a(C_i)}$$

5. Фактор полиморфизма (POF)

$$POF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} M_o(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} [M_n(C_i) \times DC(C_i)]}$$

5. Фактор полиморфизма (POF)



$$M_o(A) = 0$$

 $M_n(A) = 3$
 $DC(A) = 1$
 $M_o(B) = 1$
 $M_n(B) = 2$
 $DC(B) = 0$

$$POF = \frac{0+1}{3 \cdot 1 + 2 \cdot 0} = \frac{1}{3} = 0,33$$

Метрики Абреу: 6. Фактор сцепления (COF)

$$COF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} \left[\sum_{j=1}^{TC} is_client(C_i, C_j) \right]}{TC^2 - TC}$$

Задание

- Рассчитать значения всех метрик для спроектированных классов учебной ИС «Гостиница»
- На основе рассчитанных значений метрик провести анализ и оценку качества построенной модели

Метрики ОО систем Вопросы

- Перечислить характеристики ООИС.
- Перечислить метрики Чидамбера и Кемерера.
- Перечислить метрики Лоренца и Кидда.
- Перечислить метрики Абреу.
- Сравнить метрики. Чем они похожи? В чем различие?

Заключение

- Для оценки качества разработанных моделей используется специальный метрический аппарат
- Для объектно-ориентированных систем выделяют пять характеристик качества: локализация, инкапсуляция, информационная закрытость, наследование, абстракция
- Существует большое количество метрических систем

Список литературы

 Орлов С. Технологии разработки программного обеспечения / С. Орлов. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.